



V93000 SoC 测试系统



爱德万的可扩展平台 V93000 在一台测试系统中，能够集合最快的数字测试、精确的模拟和射频测量资源。由于大多数功能已经被集成到系统的测试头中，V93000 在提供优秀的速度同时保持最低的固有噪声。由于测试板卡本身集成度高，不同测试资源可分散管理配置，爱德万 V93000 SoC 系列提供绝佳的灵活度。只要有测试需求改变，它的模块化设计可以使你很方便的扩充系统，兼容新的模块和仪器。

特性：

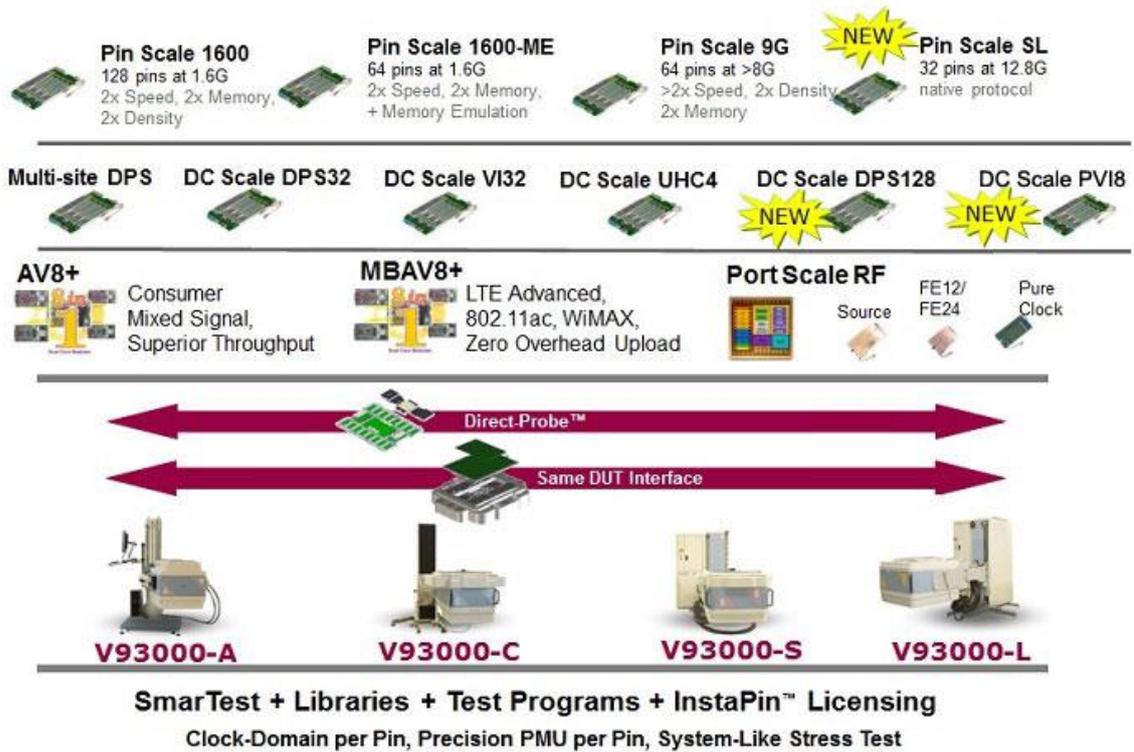
应用范围广范

覆盖从最简单低端芯片到最复杂高端产品中所有的性能测试需求:

DC,数字，模拟和射频。

最大灵活度和可扩展性

在任意测试头中支持任意板卡的组合。



V93000 Smart Scale

贯穿整个平台的兼容性

通过使用相同的硬件结构，相同的测试程序，相同的测试专板和相同的对接方式，确保新的功能能随时的添加。

随时随地得到功能满足

通过可浮动许可证在一台和多台测试机之间共享，来确保仅在需要时开启额外的功能，使得投资最优化。

最大的投资保障

通过不断升级平台，最大化的复用工程知识以及延长测试机的生命周期。

专注于单一平台的策略，爱德万 V93000 测试系统在全球不仅在工程领域，还在量产、IDM、晶圆代工厂、设计公司以及 OSAT 有广泛的用户群。

解决方案：

多功能数字方案:

V93000 多能的数字方案覆盖所有数字应用需求，包括从晶圆测试到性能测试，从消费类芯片到高端芯片，所有的一切都通过在单一平台上实现，使得客户能最大受益于其多功能性。

无线/射频方案:

V93000 无线/射频方案提供最快的测试效率和最小的测试成本，可提供高达 96 个端口，高效的 8site 同测。

消费类 SoC 方案:

V93000 消费类 SOC 方案是最佳的低成本测试方案，能够克服最新一代消费类芯片的混合信号测试所带来的挑战。

可扩展平台的不二之选

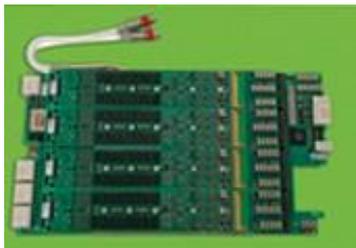
新的 V93000 SmartScale 系列产品提供最广泛的芯片测试覆盖范围，提供全系列的机台系列（从最小的 A-系列到最大的 L-系列），让您的投入得到最大的回报。



新板卡，新功能

新的 V93000 Smart Scale 系列产品推出的新功能，有效提高测试覆盖率，改进产品上市的速度，并提供优越的测试回报:

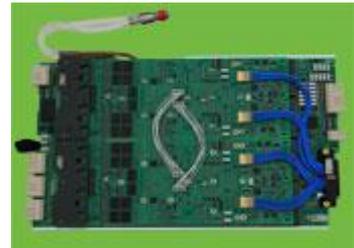
- 行业领先数字信号性能，高速输入输出通道灵活配置
- 类系统的应激测试
- 每个通道支持协议访问
- 实时存储器仿真
- SmartLoop™ (高速信号的智能回路测试)
- 增强的 SmarTest™ 软件功



Smart Scale 1600 数字板卡



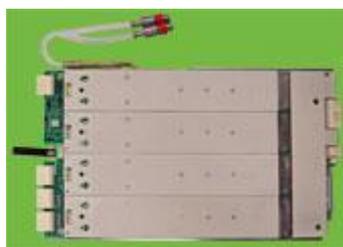
Smart Scale 9G 数字板卡



Pin Scale SL High Speed Card



MCE 模拟板卡



DC Scale DPS128



DC Scale PVI8

设立测试行业标准

Smart Test, Smart ATE, Smart Scale 爱德万 V93000 Smart Scale 系列产品以新的板卡，新的功能正在设立测试新标准。没有最好，只有更好！